

# DIN EN 61300-3-35:2010-08 (D)

**Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle und automatisierte Inspektion der Endflächen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern (IEC 61300-3-35:2009); Deutsche Fassung EN 61300-3-35:2010**

---

## Inhalt

Seite

Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Messverfahren .....	4
3.1 Allgemeines .....	4
3.2 Messbedingungen .....	5
3.3 Vorbehandlung .....	5
3.4 Erholung .....	5
4 Prüfvorrichtung .....	5
4.1 Methode A: unmittelbare Betrachtung durch ein optisches Mikroskop .....	5
4.2 Methode B: Videomikroskopie .....	5
4.3 Methode C: Videomikroskopie mit automatisierter softwaregestützter Auswertung .....	5
4.4 Anforderungen an die Kalibrierung der Systeme mit niedriger und hoher Auflösung .....	6
5 Verfahren .....	6
5.1 Messbereiche .....	6
5.2 Kalibrierverfahren .....	7
5.3 Prüfablauf .....	7
5.4 Visuelle Anforderungen .....	9
Anhang A (informativ) Beispiele von untersuchten Endflächen mit Defekten .....	11
Anhang B (normativ) Kalibrierartefakt und Verfahren zur Herstellung .....	17
B.1 Artefakt für ein hochauflösendes System .....	17
B.2 Artefakt für ein System mit niedriger Auflösung .....	19
Literaturhinweise .....	20

## Bilder

Bild 1 – Prüfablaufplan .....	8
-------------------------------	---

## Tabellen

Tabelle 1 – Messungsbereiche für Einfaser-Steckverbinder .....	6
Tabelle 2 – Messungsbereiche für Mehrfaser-Rechtecksteckverbinder mit Stift .....	7
Tabelle 3 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, $RL \geq 45$ dB .....	9
Tabelle 4 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit Schräg-Politur (APC), Einmodenfaser .....	9
Tabelle 5 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, $RL \geq 26$ dB .....	10
Tabelle 6 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Mehrmodenfaser, .....	10